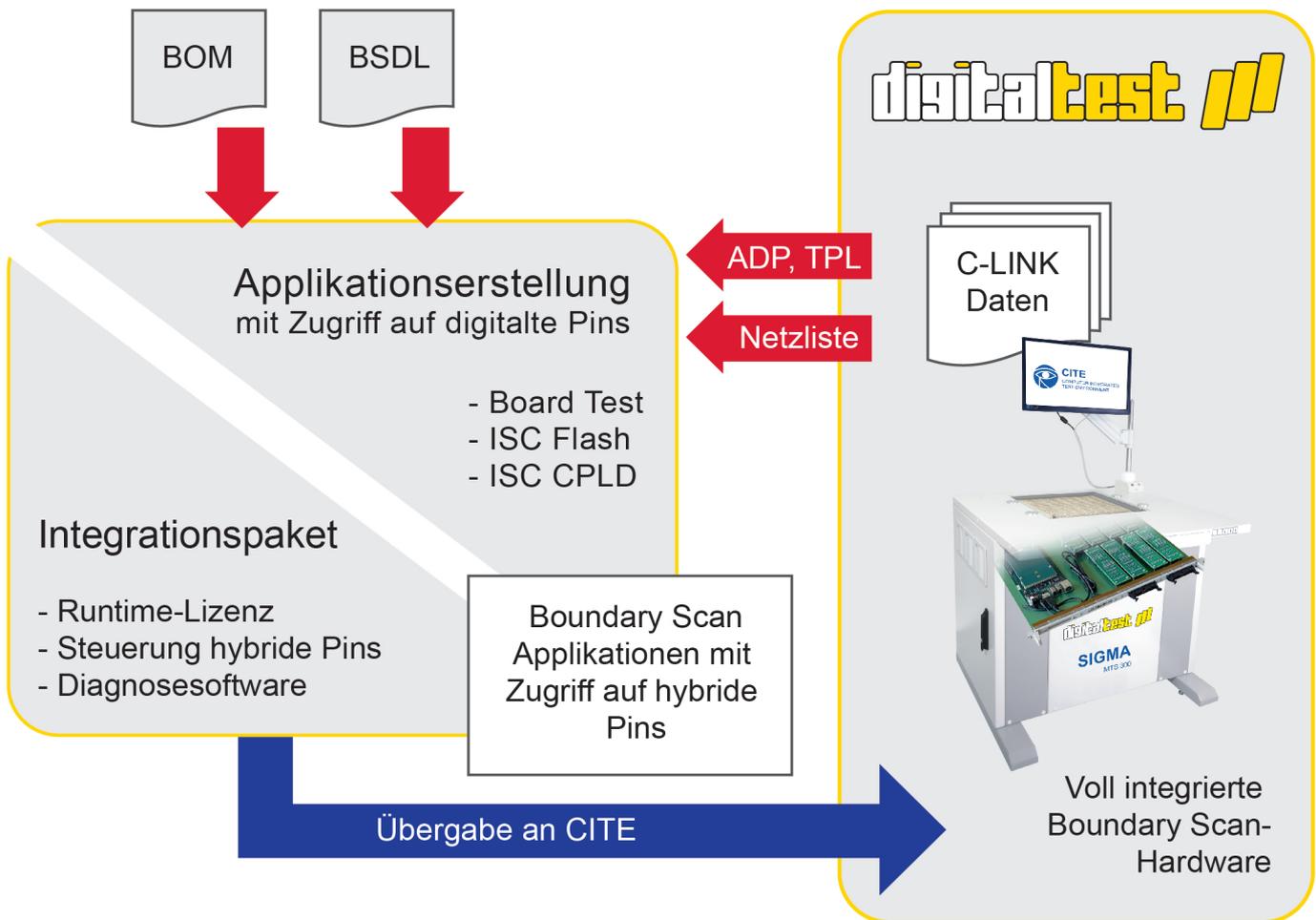


Boundary Scan für In-Circuit-Test



Mit unserer Boundary Scan Erweiterung für In-Circuit-Tests (ICT) können Sie das Beste aus beiden Prüfmethoden herausholen und eine optimale Teststrategie mit maximaler Testabdeckung und reduzierten Gesamtkosten erreichen.

- > Reduziert Adapterkosten durch Einsparung von Testpunkten
- > Nur ein Testadapter nötig für Boundary Scan und In-Circuit-Test
- > Erhöht Testabdeckung durch Integration aller Testkanäle
- > Geringe Testzeiten durch Integration mit Digitaltest-Hybridkarten
- > Einbindung aller Funktionen in CITE – Produktion bleibt in bekannter Benutzeroberfläche
- > Einfacher Datenexport mit C-LINK DTM zur Boundary Scan-Software

Unsere Hauptpartner in Sachen JTAG/Boundary Scan-Integrationen sind die namhaften Anbieter GÖPEL electronic und JTAG Technologies.